



ORIST 技術セミナー

品質管理に役立つ分析技術 －FT-IR、蛍光 X 線分析の基礎と実習－

ものづくりにおいて、製品の品質管理は重要な役割を担っています。原料の受入検査、製造時の工程検査および出荷前検査は、高い品質を保証し、不良品の発生を予防するために欠かせない工程の一つです。

本セミナーでは、品質管理でよく用いられる FT-IR（フーリエ変換赤外分光分析）、蛍光 X 線分析について、その原理や分析対象、品質管理への応用などを解説します。また、実習により、測定データの分析手法なども解説しますので、この機会にぜひご参加ください。

◆日 時：令和 5 年 2 月 28 日（火） 13:30～16:30 （受付 13:15 より）

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター（和泉市あゆみ野2-7-1）

◆内 容：

13:30-14:10 「FT-IR の基礎」 高分子機能材料研究部 主幹研究員 日置亜也子

FT-IR は、樹脂や油、塗料などの有機化合物の推定に適した分析方法です。対象物が微量でも測定可能なことから、材質の確認や異物の推定などに利用されます。本講演では、FT-IR の原理、測定事例、品質管理への応用について解説します。

14:10-14:50 「蛍光 X 線分析の基礎」 高分子機能材料研究部 主任研究員 陰地 威史

蛍光 X 線分析は、試料に含まれる元素を調べる分析方法です。非破壊かつ迅速に測定できることから、各種製品、材料の簡易元素分析や、微量有害元素のスクリーニングなどに利用されています。本講演では、蛍光 X 線分析の原理、測定事例、データ解析のポイントについて解説します。

15:00-16:30 「FT-IR」「蛍光 X 線」の分析技術（実習）

高分子機能材料研究部 主幹研究員 日置亜也子

高分子機能材料研究部 主任研究員 陰地 威史

FT-IR および蛍光 X 線分析装置を用いた実習により、分析手法と測定データの解析方法について解説します。

◆定 員：先着 10 名（※ 1 社 2 名までとさせていただきます。）

◆費 用：無料

◆お申込み：メール(izumi-entry@orist.jp)又は FAX(0725-51-2520)でお願いします。

※受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

◆お問い合わせ先：(地独)大阪産業技術研究所 顧客サービス部 TEL(0725-51-2512)

